Влияние механических напряжений на поверхностную и объемную проводимости некоторых диэлектриков Bender, Villem; Veimer, Vladimir; Mere, Arvo; Roninson, Aleksander; Silas, Aarne Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1986 / с. 65-72

#### Изменение интенсивности рентгенолюминесценции в процессе окрашивания содалитов

Ruus, Tõnu Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1986 / с. 31-37

**Изменение параметров интегральных схем при анализе в растровом электронном микроскопе Meiler, Boriss** Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1986 / с. 85-92 <a href="https://www.ester.ee/record=b1296001\*est">https://www.ester.ee/record=b1296001\*est</a>

# Измерение СВЧ фотопроводимости в материалах с высокой проводимостью

Vallaste, Heikki; Mellikov, Enn; Tuvike, Tiit; Palmre, Õie Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1986 / с. 57-63

# Исследование миграции примеси меди в монокристаллах сульфида кадмия

Aarna, Heiti; Reiter, Erik Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1986 / с. 43-48

#### Перераспределение вещества в поле внешних сил

Aarna, Heiti; Mankin, Romi; Reiter, Erik Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1986 / с. 39-41

#### Применение в ТПИ растворного электронного микроскопа в материаловедении

Paat, Aadu Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1986 / с. 79-84

## Природа красной полосы люминесценции в CdS : Ag : CI

Krustok, Jüri; Mädasson, Jaan; Altosaar, Mare Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1986 / с. 23-30

#### Установка для многократного анодного окисления полупроводников

Gavrilov, Aleksei Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1986 / с. 73-78

## Физико-химический анализ несовершенных полупроводниковых кристаллов

Kukk, Peeter-Enn Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1986 / с. 3-22

# Электрофизические свойства тонкопленочных барьеров шоттки на основе сульфида кадмия, изготовленного методом химической пульверизации

Krunks, Malle; Mellikov, Enn; Seilenthal, Mats Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1986 / с. 49-55